

Achieving accuracy in charge carrier mobility modelling in silicon

Mnatsakanov, T.T.; Gresserov, B.N.; Pomortseva, L.I. Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennial conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S / Tallinn Technical University 1992 / p. 89-94: ill

Band gap engineering by cationic substitution in Sn(Zr1-xTix)Se3 alloy for bottom sub-cell application in solar cells

Kondrotas, Rokas; Pakstas, Vidas; Franckevicius, Marius; Suchodolskis, Arturas; Tumenas, Saulius; Jasinskas, Vidmantas; Juskenas, Remigijus; Krotkus, Arunas; **Muska, Katri; Kauk-Kuusik, Marit** Journal of materials chemistry A 2023 / p. 26488–26498 <https://doi.org/10.1039/D3TA05550G>

Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC

Velmre, Enn; Udal, Andres Physica scripta 1999 / Proceedings of 18th Nordic Semiconductor Meeting, Linköping, Sweden, June 7-10, 1998, ISBN 91-87308-71-1, p. 193-197: ill <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhST...79..193V/abstract>

Correlation between the UV-reflectance spectra and the structure of poly-Si films obtained by aluminium induced crystallization

Dimova-Malinovska, D.; Angelov, O.; Sendova-Vassileva, M.; **Mikli, Valdek** Journal of optoelectronics and advanced materials 2009 / 9, p. 1079-1085 https://www.researchgate.net/publication/288122478_Correlation_between_the_UV-reflectance_spectra_and_the_structure_of_poly-Si_films_obtained_by_Aluminium_Induced_Crystallization

Electrochemical deposition of thin polypyrrole films on silicon substrates

Intelmann, Carl Matthias; **Sõritski, Vitali**; Tsankov, Dimiter; Hinrichs, Karsten; Rappich, Jörg 5th ISE Spring Meeting : Dublin (Ireland), 01.-04.05.07 2007 / ? p

Electrochemically deposited ultrathin polypyrrole films on silicon

Intelmann, Carl Matthias; **Sõritski, Vitali**; Tsankov, Dimiter; Hinrichs, Karsten; Rappich, Jörg GDCh (German Chemical Society) - YoungChemists : Spring Symposium 2007 : Chemnitz (Germany), 22.-24.03.07 2007 / ? p

From virtual characterization to test-chips : DFM analysis through pattern enumeration

Martins, Mayler G.A.; **Pagliarini, Samuel Nascimento**; Isgenc, Mehmet Meric; Pileggi, Larry IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems 2020 / p. 520-532 <https://doi.org/10.1109/TCAD.2018.2889772>

Impurity interaction with point defects in the Si-SiO2 structures and its influence on the interface properties

Kropman, Daniel; Mellikov, Enn; Kärner, T.; Ugaste, Ülo; Laas, Tõnu; Heinmaa, I.; Medvid, A. Materials science and engineering : B 2006 / p. 222-226 : ill <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510706004375>

Jaan Raik: kiibidisain aitaks saada Eestil jõukaks tehnoloogiamaks

Maidla, Margus novaator.err.ee 2023

Kassikuld võib osutuda elektroonikatööstuses kullast kallimaks

Kristmann, Katriin novaator.err.ee 2024 [Kassikuld võib osutuda elektroonikatööstuses kullast kallimaks](#)

Keemia tee klaasist ränisse : tänavune Nobeli keemiaauhind seab õigluse jalule keemiateoreetikute ja arvutikeemikute hulgas

Strandberg, Marek Sirp 2013 / lk. 26 <https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/2013-10-17-20-15-58-2/>

Kleenukesed päikeseelemendid aitaks vältida ränipaneele ootavat kriisi

Sibinski, Maciej novaator.err.ee 2024 [Kleenukesed päikeseelemendid aitaks vältida ränipaneele ootavat kriisi](#)

Modelling of charge carrier non-isothermal transport in silicon and silicon carbide

Velmre, Enn; Udal, Andres Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2000 / 2, p. 144-154 : ill

Must räni töi helged lootused

Krustok, Jüri Eesti Päevaleht 2000 / 19. veebr., lk. 23 https://artiklid.elnet.ee/record=b1637055*est

Porphyrin-based hybrid nanohelices : cooperative effect between molecular and supramolecular chirality on amplified optical activity

Anfar, Zakaria; Kuppan, Balamurugan; Scalabre, Antoine; Nag, Rahul; Pouget, Emilie; Nlate, Sylvain; Magna, Gabriele; Di Filippo, Ilaria; Monti, Donato; Naitana, Mario L.; Stefanelli, Manuela; **Nikonovich, Tatsiana; Borovkov, Victor; Aav, Riina**; Paolesse, Roberto; Oda, Reiko The journal of physical chemistry B 2024 / p. 1550-1556 <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c07153>

Production of silicon free master alloys in Estonia

Gorkunov, Valeri; Munter, Rein Scientific proceedings of Riga Technical University. 1. [series], Material science and applied chemistry 2007 / p. 111-121

Päikeseenergeetika tulevikku kujundavad kilepinnad ja tandempaneelid

Piir, Rait novaator.err.ee 2023 [Päikesenergeetika tulevikku kujundavad kilepinnad ja tandempaneelid](#)

Relationships between essential and non-essential elements in plants with different nutritional strategies and silicon absorption capacities : [manuscript]

Monei, Nthati Lilian; Benyr, V.; Heilmeier, Hermann; Hitch, Michael William; Wiche, Oliver The international journal of environment & health 2023

Review of - SiC wide-bandgap heterostructure properties as an alternate semiconductor material

Patankar, Udayan Sunil; Rajput Priti, J.; Koel, Ants; Nitnaware, V.N. International Conference on Inventive Research in Material Science and Technology, ICIRMCT 2018 : March 23-24, 2018 2018 / art. 020011 <https://doi.org/10.1063/1.5038690> [Conference proceedings at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Article at WOS](#)

Selective laser melting of commercially pure silicon

Lai, Zhouyi; Guo, Ting; Zhang, Shengting; Kollo, Lauri; Attar, Hooyar; Wang, Zhi; Prashanth, Konda Gokuldoss Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition 2022 / p. 1155 - 1165 <https://doi.org/10.1007/s11595-022-2647-3> [Journal metrics at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Journal metrics at WOS](#) [Article at WOS](#)

Silica granulates in concrete - dispersion and durability aspects

Lagerblad, Björn; Utkin, Pjotr 1993 https://www.ester.ee/record=b1025989*est

Study of ion implanted Fe depth distribution in Si after pulsed ion beam treatment

Angelov, Christo; Georgiev, S.; Amov, Blagoj; Goranova, E.; Mikli, Valdek; Dezs, I.; Kotai, E. Journal of optoelectronics and advanced materials 2007 / 2, p. 307-310
https://www.researchgate.net/publication/289186791_Study_of_the_ion_implanted_Fe_depth_distribution_in_Si_after_pulsed_ion_beam_treatment

The role of silicon in the hot dip galvanizing process

Sepper, Sirli; Peetsalu, Priidu; Kulu, Priit; Saarna, Mart; Mikli, Valdek Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 2016 / p. 159-165 : ill

Ursache und Wirkungsweise der Alkalireaktion in den aus estnischem Portlandölschieferzement hergestellten Betonen

Kikas, Verner; Ojaste, Kalju; Raado, Lembi-Merike ZKG International = Zement, Kalk, Gips international 1999 / 2, S. 106-111

Valgustkiirgav räni

Krustok, Jüri Horisont 2001 / 1, lk. 12

Üliõhuke päikesepaneel avab energia tootmisele uued ukсед

Alvela, Ain; Krautmann, Robert novaator.err.ee 2023 [Üliõhuke päikesepaneel avab energia tootmisele uued ukсед](#)
<https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e7e64926-5d49-40ad-8b3a-e225ea034f7d> Ученый из Эстонии разрабатывает солнечные панели, которые изменят мир

Инжекционные зависимости времени жизни неосновных носителей заряда в кремнии, легированном золотом и платиной

Udal, Andres Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 101-105 : ил, табл https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Испульсное легирование кремния в сильноточном газовом разряде

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Письма в Журнал технической физики 1982 / с. 388-391 https://www.ester.ee/record=b2142356*est

Комплексное рентгенодифракционное исследование строения нарушенных слоев, обусловленных резкой кремнии

Milvidski, M.; Fomin, V.; Meiler, Boriss Физика и химия обработки материалов 1986 / с. 122-125
https://www.ester.ee/record=b1804847*est

Межфазное взаимодействие на контакте Ni-Si и Ni-GaAs

Meiler, Boriss Поверхность : физика, химия, механика 1985 / с. 62-67 : илл https://www.ester.ee/record=b2149829*est

Наращивание поликристаллических слоев кремния на рельефную поверхность двуокиси кремния

Paat, Aadu; Timma, Enn; Trombovetski, A. Труды по физике : сборник статей. 6 1973 / с. 27-33 : илл
https://www.ester.ee/record=b2190564*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/020d3bce-d60f-45bd-aa8f-4906f2c1d0d6>

О целесообразности увеличения обратного напряжения силовых кремниевых диодов

Vaher, G.; Tarma, Mati Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 21-24
https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Об определении экологических ПДК для минеральных форм азота, фосфора и кремния в водных объектах
Säärekõnno, Jüri Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 32-36: ill

Отжиг имплантированных слоев кремния в плазме импульсного газового разряда
Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Физика и техника полупроводников = Physics and technics of semiconductors 1981 / с.1232-1234 https://www.ester.ee/record=b1263919*est

Получение высокохромистых сплавов TiC-Fe-Cr, легированных кремнием
Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1986 / с. 65-69 : рис., таб https://www.ester.ee/record=b1645489*est

Применение анодного окисления при исследовании электрофизических характеристик полупроводниковых структур "кремний на изоляторе"
Gavrilov, Aleksei Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 53-59: ill

Скорость связывания кремнезема песка в случае образования высоковольтных гидросиликатов кальция
Reiman, Värdi Сборник трудов (НИПИ силикатобетон) 1969 / с. [?] https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Структура и глубина нарушенного слоя при грубой абразивной обработке монокристаллического кремния
Meiler, Boriss; Hatskevits, M.; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 60-71: ill

Термообработка пластин кремния с нарушенным слоем
Meiler, Boriss; Ladotškin, A.; Fomin, V. Tallinna Tehnikaülikooli Toimetised 1990 / lk. 72-86: ill

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур
Velmre, Enn; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79
https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и тиристорных структурах в открытом состоянии
Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 / с.37-38

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме
Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?